

AVR236 : プログラム メモリのCRC検査

要点

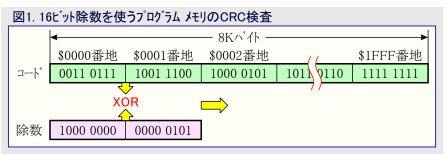
- プログラム メモリのCRC生成と検査
- LPM命令を持つ全てのAVR[®]を支援
- 簡潔なコート^{*}量、44語(CRC生成とCRC検査)
- SRAMの必要条件なし
- EEPROM格納のチェックサム
- 実行時間: 90ms(AT90S8515/8MHz)
- 16ビット実装、32ビットへの容易な変更
- CRC-16規格支援、CRC-CCITT,CRC-32への容易な変更

序説

この応用記述はCRC(Cyclic Redundancy Check,巡回冗長検査)の原理とAtmel AVRマイクロコントローラのプログラムメモリでの誤りを検出するためのCRC実装を記述します。

CRCは雑音の多い経路を伝わって伝達されるメッセージでの誤りを検出する方法に広く用いられています。安全なマイクロコントローラ応用のための新しい規格、マイクロコントローラのプログラムメモリでの誤り検出の方法としてCRCが導入されました。実際の応用で使うMCU資源をより解放するので、データ記憶メモリに対する低い必要条件と簡潔なコートでのCRC計算実装は望ましいことです。

この応用記述で用いるCRCの実装は最小コード量とレジスタ使用に最適化されています。



動作の理屈

チェックサムは雑音の多い経路を通る通信で始めて使われました。数値(チェックサム)は送出メッセージ の関数として計算されます。受信側はチェックサムを計算するのに同じ関数を用い、その計算され た結果を送信側からの受信値と比較します。

この応用記述ではチェックサムがコードの関数として構築されて内部EEPROMに格納されます。マイクロコントローラは後でコードのチェックサムを計算するのに同じ関数を用い、そして追加されたチェックサムと比較することができます。

例: コードの数値の総和によって計算されたチェックサム(以下、同様記述は16進数)

- コード 歹川
 : 04 29 06
- ・チェックサム付きコード列 : 04 29 06 39

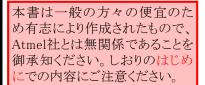
このチェックサムはコートの数値の単純な総和です。

コート、内の第2ハイトが\$29から\$23へ不正に変えられた場合、元のチェックサムが計算されたチェックサム と比較された時に誤りが検出されます。

- ・元のチェックサム付きコード列 : 04 29 06 39
- ・ 誤りを持つコート 列: 04 23 06 39 (33) ← 誤(後計算チェックサム不一致)

コート、内の先頭ハイトが\$04から\$10へ、それと第2ハイトが\$29から\$23へ不正に変えられた場合、 チェックサムは誤りを検出しません。

- ・元のチェックサム付きコード列 : 04 29 06 39
- ・誤りを持つコートが列 : 10 23 06 39 (39) ← 正(後計算チェックサム一致、実際は誤)



Rev. 1143B-05/02, 1143BJ3-03/21





8-bit **AVR**[®] マイクロ コントローラ





このチェックサムが持つ問題はそれが単純すぎることです。それはコード内の複数の誤りを検出できないかも知れず、そしてチェックサムそれ自身での誤りを検知できないかもしれません。

この例は加算が誤り検出に充分ではないことを示します。CRC計算はコートに対する計算に加算の代わりに除算を用います。原理は同様ですが、除算を使うことにより、複数ビットの誤りと集中誤りが検出されます。

CRC算法は巨大な2進値としてプログラムメモリを扱い、そしてそれは別の固定2進数で除算されます。この除算の剰余がチェックサムです。マイクロ コントローラは後で同じ除算を実行して剰余を(元々)計算されたチェックサムと比較します。

この除算は(剰余2の)多項式演算を使い、そしてそれは桁溢れを全く使わないことを除き、通常の2進数演算と同じです。多項式演算が持つ数値の加算は単にデータをXORするだけです。

例: 多項式演算に於ける加算

- 1011 0110
- + 1101 0011
- $\overline{0110}$ 0101

この加算は2つの数のXORと等価です。

多項式演算に関するいくつかの特性を定義しましょう。

- M(x) = kビットの数値 (検査すべきコード)
- G(x) = (n+1)ビットの数値 (除数または多項式)
- R(x) = k>nとなるようなnビットの数値 (剰余またはチェックサム)

$$\frac{M(x) \times 2^{n}}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$$
;ここのQ(x)は商

今やQ(x)は次のように記述することができます。

$$Q(x) = \frac{M(x) \times 2^n + R(x)}{G(x)}$$
; $M(x) \times 2^n$ はコードの最後にn個の0を追加するのに等しい

 $\frac{M(x) \times 2^{n}}{G(x)}$ が次式に於いて置換されると、

$$\frac{M(x) \times 2^{n} + R(x)}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)} + \frac{R(x)}{G(x)} = Q(x)$$

そしてこれは除数と剰余が同じ数値で、それ自身への加算がXORと同じで0を返すため、Q(x)に等しくなります。

CRC除算の例

16進数の\$6A(2進数の0110 1010)が除数\$9(2進数の1001)で除算されます。チェックサムは1001での0110 1010除算操作の剰余です。 最初に元のメッセージ(ビット列)の最後にW個の0を追加してください(ここでのWは除数の幅(ビット数)です)。

$011010100000 \div 1001 = 01100$	・・・・・ 商は無視されます。
0000	・・・・・・被除数の今回分MSBが0なので除算なし。
1 101	
1001	・・・・・・被除数の今回分MSBが1なので除算有り。
1000	
1001	・・・・・・被除数の今回分MSBが1なので除算有り。
0011	
0000	・・・・・・被除数の今回分MSBが0なので除算なし。
0110	
0000	・・・・・・被除数の今回分MSBが0なので除算なし。
1100	
1001	・・・・・・被除数の今回分MSBが1なので除算有り。
1010	
1001	・・・・・・被除数の今回分MSBが1なので除算有り。
0110	
0000	・・・・・・被除数の今回分MSBが0なので除算なし。
1100	
1001	・・・・・・被除数の今回分MSBが1なので除算有り。
0101 =5=剰余=チェックサム	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	i i kaka kata i kaka i i kaka kata i ka

元のメッセージ(ビット列)の最後にこのチェックサムが追加されます。結果のコートは\$6A5です。このコートが検査される時にコートと(追加された) チェックサムが除数で除算されます。誤りが全く起きていなければこの除算の剰余は0で、さもなければ0以外です。

(訳補) 上記計算例で、最初に追加した'0000'がチェクサム'0101'に置き換わることなので、当然結果は0になります。そもそもこの計算は 仮に追加した'0000'に相当する剰余を求めるのですから・・・。

AVR236

AVR236

CRC検出に関して今日様々な規格が用いられています。除数の種類は8~32と一様でなく、誤り検出能力は使われる除数の幅で変わります。一般的に使われるいくつかのCRCの除数は以下です。

CRC-16 = 1 1000 0000 0000 0101 = \$8005

CRC-CCITT = 1 0001 0000 0010 0001 = \$1021

CRC-32 = 1 0000 0100 1100 0001 0001 1101 1011 0111 = \$04C11DB7

16ビット除数に於ける実際のビット数は17で、32ビット除数に於ける実際のビット数が33であることに注意してください。最上位ビット(MSB) は常に1です。

ソフトウェアの説明

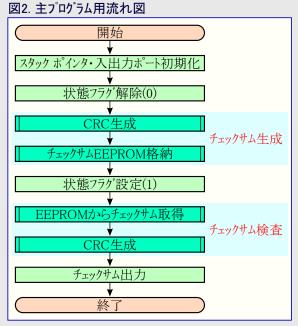
主プログラム

主プログラムはCRC生成とCRC検査の両操作を示すために提供されます。生成されたチェックサムは内部EEPROMに格納され、CRC検査が実行される前に読み戻されます。

殆どの応用では書き込み器によってチェックサムが生成され、そしてプログラムメモリの最終番地に置かれます。

コートに対する新しいチェックサムを生成するために、主プログラムはリセット後に状態 フラグレジスタ=\$00でcrc_genサブルーチンを呼び出します。生成されたチェックサムは EEPROMに格納されます。

CRCチェックサムを検査するために、状態フラグレジスタ=\$FFまたは\$00以外の何れかの値でcrc_genサブルーチンが呼び出されます。



CRCチェックサム生成

この操作はビット単位でプログラムメモリ全体を回転する原理に基きます。MSBがキャリーフラグへ移されます。キャリーフラグが1なら、語が除数とXORされます。キャリーフラグへ移されたプログラムメモリのMSBも除数のMSBとXORされることに注意してください。これらが両方とも1で結果が常に0なので、この除算(XOR)は無視されます。

プログラムメモリの最後で、16個の0がコートに追加されます。チェックサムはXOR操作完了の結果値です。

CRCチェックサム検査

生成と同じ原理が適用されますが、生成されたチェックサムがコートに追加され、0を置き換えます。追加されたチェックサムを含む計算の結果は誤りが起きていなければ0で、さもなければ0以外です。

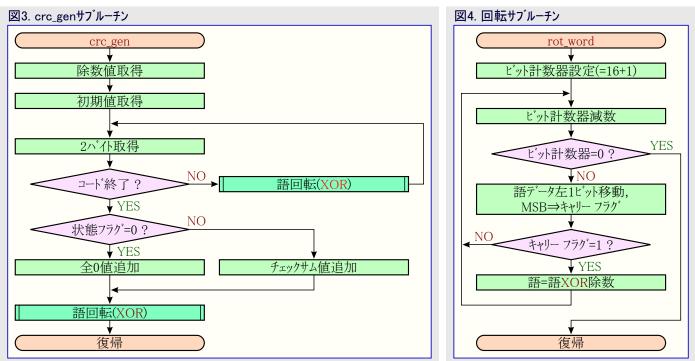
(既に)チェックサムがプログラムコートに含まれている場合、プログラムコートに於いて計算の検査部分だけが行われることが必要です。

CRC生成とCRC検査の両方に同じルーチンが使われます。全域状態フラグレジスタはCRC生成を実行するための関数呼び出しで\$00を 格納されます。この状態フラグレジスタが関数呼び出しで\$00と違うどの値を可能されても、関数はCRCチェックサム検査を実行します。 流れ図はCRC生成とCRC検査の両方を含むcrc_genルーチンの流れを示します。

図3.と図4.の流れ図はcrc_genサブルーチンの操作を記述します。







変更

コート、例はCRC-16計算に16ビットのチェックサムを実行します。このコート、はコート、緩衝部の容量を32から64ビットへ増やして除数の容量を16から32ビットへ増やすことにより、32ビットのチェックサムを支援するように簡単に変更できます。

チェックサムが書き込み器によって生成され、そして最終メモリ位置に置かれる場合、チェックサムを検査するためのコートだけがプログラムに含められることを必要とします。ルーチンの最後の部分のコートを削除することができます。コード内の注釈をご覧ください。

いくつかのCRC算法は\$00と異なる初期値を持つデータレジスタが必要です。他の値が使われる場合、最初の2つのLPM命令を置き換えて、そのレジスタ内に初期値を格納することができます。より多くの情報についてはコートウの注釈をご覧ください。

CRC算法が反転される場合、これはMSBの代わりにハイトのLSBが最初に移動されることを意味し、ルーチンはLSL(論理的ビット左移動)と ROL(ビット左回転)の命令をLSR(論理的ビット右移動)とROR(ビット右回転)の命令で置き換えることによってこれを支援することができます。

より速い速度の既存CRC計算の別の実装の殆どは操作の速度を増すために参照表を用います。このような応用に対するSRAMの必要条件がそれらをもっと複雑なシステムに適応させます。

資源

ALC: N	表1. CPUとメモリの使用							
	関数	コート 量(語)	周期数	使用レジスタ	割り込み	説明		
	main	36	-	R2,R3,R16,R22~R25	-	初期化と例プログラム		
	crc_gen	44	概ね 700,000	R0~R3,R17~R22, R30,R31	-	CRCチェックサムの生成と検査		
	eewrite	7	13	R16,R23~R25	_	EEPROMへCRCチェックサム書き込み		
	eeread	4	8	R16,R23~R25	_	EEPROMからCRCチェックサム読み込み		
	合計	91	-		-			

表2. 周辺機能の使用

周辺機能	説明	
EEPROM (2パイト)	CRC值格納	
ポートBの8つのI/Oピン	LED用にCRCの下位バイト出力	

参考文献

Fred Halsall "Data Communication, Computer Networks and Open Systems" 1992 Addison-Wesley Publishers RossN.Williams "The Painless Guide to Error Detection Algorithms" ftp://ftp.rocksoft.com/papers/crc_v3.txt



本社

Atmel Corporation

2325 Orchard Parkway San Jose, CA 95131, USA TEL 1(408) 441-0311 FAX 1(408) 487-2600

国外営業拠点

Atmel Asia

Unit 1–5 & 16, 19/F BEA Tower, Millennium City 5 418 Kwun Tong Road Kwun Tong, Kowloon Hong Kong TEL (852) 2245–6100 FAX (852) 2722–1369

Atmel Europe

Le Krebs 8, Rue Jean-Pierre Timbaud BP 309 78054 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex France TEL (33) 1-30-60-70-00 FAX (33) 1-30-60-71-11

Atmel Japan

104-0033 東京都中央区 新川1-24-8 東熱新川ビル 9F アトメル ジャパン株式会社 TEL (81) 03-3523-3551 FAX (81) 03-3523-7581

製造拠点

Memory

2325 Orchard Parkway San Jose, CA 95131, USA TEL 1(408) 441-0311 FAX 1(408) 436-4314

Microcontrollers

2325 Orchard Parkway San Jose, CA 95131, USA TEL 1(408) 441-0311 FAX 1(408) 436-4314

La Chantrerie BP 70602 44306 Nantes Cedex 3 France TEL (33) 2-40-18-18-18 FAX (33) 2-40-18-19-60

ASIC/ASSP/Smart Cards

Zone Industrielle 13106 Rousset Cedex France TEL (33) 4-42-53-60-00 FAX (33) 4-42-53-60-01

1150 East Cheyenne Mtn. Blvd. Colorado Springs, CO 80906, USA TEL 1(719) 576-3300 FAX 1(719) 540-1759

Scottish Enterprise Technology Park Maxwell Building East Kilbride G75 0QR Scotland TEL (44) 1355-803-000 FAX (44) 1355-242-743

RF/Automotive

Theresienstrasse 2 Postfach 3535 74025 Heilbronn Germany TEL (49) 71-31-67-0 FAX (49) 71-31-67-2340

1150 East Cheyenne Mtn. Blvd. Colorado Springs, CO 80906, USA TEL 1(719) 576-3300 FAX 1(719) 540-1759

Biometrics

Avenue de Rochepleine BP 123 38521 Saint-Egreve Cedex France TEL (33) 4-76-58-47-50 FAX (33) 4-76-58-47-60

> 文献請求 www.atmel.com/literature

© Atmel Corporation 2002.

Atmel製品は、ウェブサ仆上にあるAtmelの定義、条件による標準保証で明示された内容以外の保証はありません。本製品は改良のため予告なく変更される場合があります。いかなる場合も、特許や知的技術のライセンスを与えるものではありません。Atmel製品は、生命維持装置の重要部品などのような使用を認めておりません。

本書中の[®]、[™]はAtmelの登録商標、商標です。 本書中の製品名などは、一般的に商標です。

© HERO 2021.

本応用記述はAtmelのAVR236応用記述(doc1143.pdf Rev.1143B-05/02)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複する 形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意訳されている部分もあります。必要に応じて一部 加筆されています。頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

必要と思われる部分には()内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。